

Arvutitehnika riistvara : õpik kõrgkoolidele

Evertson, Teet 2013 https://www.ester.ee/record=b2967116*est

Diagnostic modelling of digital systems with binary and high-level decision diagrams

Ubar, Raimund-Johannes; Raik, Jaan; Kruus, Helena; Lensen, Harri; Evertson, Teet Progress in industrial mathematics at ECMI 2006 2008 / p. 902-907 : ill https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71992-2_158

Diagnostic modelling of digital systems with multi-level decision diagrams

Ubar, Raimund-Johannes; Raik, Jaan; Evertson, Teet; Kruus, Margus; Lensen, Harri Proceedings of the 17th IASTED International Conference on Modelling and Simulation : May 24-26, 2006, Montreal, Quebec, Canada 2006 / p. 207-212 : ill

Fault diagnosis in integrated circuits with BIST

Ubar, Raimund-Johannes; Kostin, Sergei; Raik, Jaan; Evertson, Teet; Lensen, Harri 10th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools, DSD 2007 : 29-31 August 2007, Lübeck, Germany : proceedings 2007 / p. 604-610 : ill <http://dx.doi.org/10.1109/DSD.2007.4341530>

FPGA technological mapping for low power implementation

Kasirova, Lilia; Evertson, Teet; Tveretina, Olga Proceedings of the 4th International Workshop Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : MIXDES'97 : Poznan, Poland, 12-14 June 1997 1997 / p. 259-264

FPL curriculum at Tallinn Technical University

Tammemäe, Kalle; Evertson, Teet Field-programmable logic and applications : the Roadmap to Reconfigurable Computing : 10th International Conference, FPL 2000 : Villach, Austria, August 2000 : proceedings 2000 / p. 830-833
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-44614-1_96.pdf

Functional built-in self-test for processor cores in SoC

Ubar, Raimund-Johannes; Indus, Viljar; Kalmend, Oliver; Evertson, Teet; Orasson, Elmet 30th IEEE NORCHIP Conference : Copenhagen, Denmark, November 12-14, 2012 2012 / p. 1-4 : ill <https://ieeexplore.ieee.org/document/6403148>

HDL-s for students with different background

Reinsalu, Uljana; Arhipov, Anton; Evertson, Teet; Ellervee, Peeter Proceedings MSE 2007 : 2007 IEEE International Conference on Microelectronic Systems Education : 3-4 June 2007, San Diego, CA 2007 / p. 69-70
<https://ieeexplore.ieee.org/document/4231454>

Hierarchical fault diagnosis in embedded digital systems with multi-level decision diagrams [Electronic resource]

Ubar, Raimund-Johannes; Evertson, Teet; Lensen, Harri; Aarna, Margit 5th International Conference on Industrial Automation = Cinquieme Conference Internationale sur l'Automatisation Industrielle : June 11-13, 2007, Montreal, Canada 2007 / [6] p. [CD-ROM]

Internet-based software for teaching test of digital circuits

Ubar, Raimund-Johannes; Jutman, Artur; Orasson, Elmet; Raik, Jaan; Evertson, Teet; Wuttke, Heinz-Dietrich Microelectronics education : proceedings of the 4th European Workshop on Microelectronics Education : EWME 2002, Spain, May 23-24, 2002 2002 / p. 317-320 : ill <https://ieeexplore.ieee.org/document/1003344>

Java applet for self-learning of digital test issues [Electronic resource]

Ubar, Raimund-Johannes; Orasson, Elmet; Evertson, Teet 13th EAEEIE Annual Conference, 8th-10th April, 2002, York, England 2002 / [4] p. [CD-ROM]

Self-learning tool for digital test

Ubar, Raimund-Johannes; Orasson, Elmet; Evertson, Teet Proceedings of 2nd International Conference "Distance Learning - Educational Sphere of the XXI Century" 2002 / p. 36-38 : ill

Sünkroonsete järjestikülütuste testide deduktiivse analüüsi meetod

Evertson, Teet; Ubar, Raimund-Johannes XXIX vabariiklik üliõpilaste teaduslik- tehniline konverents 30. märtsist - 1. aprillini 1977 : ettekannete teesid 1977 / lk. 42 https://www.ester.ee/record=b2449987*est

Teaching diagnostic modeling of digital systems with decision diagrams [Electronic resource]

Ubar, Raimund-Johannes; Raik, Jaan; Mironov, Dmitri; Evertson, Teet; Orasson, Elmet; Aarna, Margit; Wuttke, Heinz-Dietrich Proceedings of 12th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education - CATE 2009 : St. Thomas, US, November 22-24, 2009 2009 / p. 1-6. [CD-ROM]

A tool for teaching hierarchical fault diagnosis in digital circuits

Ubar, Raimund-Johannes; Kostin, Sergei; Orasson, Elmet; Evertson, Teet; Brik, Marina Proceedings of 9th European Workshop on Microelectronics Education – EWME'12 : Grenoble, France, May 9-11, 2012 2012 / p. 1-4

Генерирование тестов для микропроцессорных БИС

Viilup, Agu; Evertson, Teet Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1983 / с. 121-129 : ил

https://www.ester.ee/record=b1288991*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7d7515af-76b7-4d35-89a7-e80367d5b635>

Единый подход к решению задач тестового диагностирования дискретных систем

Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Evertson, Teet IX симпозиум по проблеме избыточности в информационных системах, 3 июня - 8 июня 1986 года : Тезисы докладов 1986 / с. 32-35

Единый подход к решению задач тестового диагностирования дискретных систем

Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Evertson, Teet IX симпозиум по проблеме избыточности в информационных системах, 3-8 июня 1986 г. : тезисы докладов 1986 / с. 32-35

Исследование и разработка методов управления поиском дефектов в цифровых схемах : автореферат кандидата технических наук (05.13.01)

Evertson, Teet 1986 https://www.ester.ee/record=b1301665*est

Локализация дефектов в цифровых схемах

Evertson, Teet Машинное проектирование электронных устройств и систем 1986 / с. 110-119

Метод алгоритмического генерирования тестов при контроле цифровых схем

Grigorjeva, Ksenja; Lohuaru, Tõnu; Evertson, Teet Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 75-83 : илл https://www.ester.ee/record=b1328194*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b>

Моделирование цифровых схем при длинных импульсных последовательностях

Evertson, Teet Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1984 / с. 15-26 : ил

https://www.ester.ee/record=b1549179*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/99cc4681-4aa3-466a-b6da-b76f575d0f1e>

О моделировании длинных входных последовательностей в дискретных устройствах, содержащих счетные структуры

Ubar, Raimund-Johannes; Evertson, Teet Методы синтеза и диагностирования цифровых схем 1985 / с. 61-74

https://www.ester.ee/record=b1302568*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e00f2c15-fd8c-48ac-9963-76da1d62d592>

Об одном подходе к моделированию цифровых схем, содержащих счетные структуры

Evertson, Teet; Mištšenko, Andrei Проектирование и диагностика вычислительных средств 1987 / с. 53-63 : илл

https://www.ester.ee/record=b1273275*est

Оптимизация процессов диагностирования цифровых устройств в реальном времени

Grigorjeva, Ksenja; Lohuaru, Tõnu; Evertson, Teet; Ubar, Raimund-Johannes Вычислительная техника : тезисы докладов республиканской конференции "Автоматизированное техническое проектирование электронной аппаратуры" (1-2 июня 1982 г.) 1982 / с. 144

Управление процессами диагноза логических схем

Toome, T.; Ubar, Raimund-Johannes; Evertson, Teet Тезисы докладов XXXI студенческой научно-технической конференции 1980 / с. 55-57 https://www.ester.ee/record=b1319482*est

Управление процессом поиска дефектов в цифровых схемах содержащих счётные структуры

Viilup, Agu; Ubar, Raimund-Johannes; Evertson, Teet Межреспубликанская школа-семинар по технической диагностике, 8-12 октября 1984 года : тезисы докладов 1984 / с. 28-32 https://www.ester.ee/record=b1237891*est

Электротехника и автоматика

Rüstern, Ennu; Leis, Paul; Sudnitsõn, Aleksander; Viies, Vladimir; Berkman, Boriss; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Ubar, Raimund-Johannes; Alango, Villem; Kont, Toomas; Grigorjeva, Ksenja; Einasto, N.; Evertson, Teet; Gerasimtšuk, Valeri; Mahhitko, V.P.; Šendrik, M.G.; Tamm, Boris, inform. 1986 https://www.ester.ee/record=b1296477*est